

技術分野：解析

大学名：関西学院大学

研究成果	X線を用いた表面・界面の構造評価
利用分野	物性計測
中小企業が利用できるシーズの概要	
関西学院大学 理工学部 高橋 功 研究室	
・技術内容 X線を用いて半導体、金属、強誘電体などの硬いモノからポリマー、ガラス、コロイドなどのやわらかいモノまで表面・界面構造の研究を行っている。	
・応用例 顕微鏡等では観測できない微小サイズの ・アモルファス薄膜中の微小結晶 ・表面界面の平坦性、荒れ特性 ・液体表面の粘性、表面張力等の評価・検出が可能。	